

<<数字电路典型实验范例剖析>>

图书基本信息

书名：<<数字电路典型实验范例剖析>>

13位ISBN编号：9787115124029

10位ISBN编号：7115124027

出版时间：2004-7

出版时间：第1版 (2004年1月1日)

作者：赵博

页数：158

字数：248000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## <<数字电路典型实验范例剖析>>

### 内容概要

本书为配合数字电路课程的教学以及教学改革而编写，目的在于强化动手能力、创新能力的培养和提高。

本书分为“基础知识”、“单元实验”和“课程设计”3部分。

第一部分基础知识简要介绍了数字电路设计的相关器件（单片机、DSP、嵌入式系统、可编程器件），使初学者对这些器件的开发有大致地了解。

第二部分单元实验包括基本门特性分析、TTL电路单元实验，时序/组合逻辑实验。

第三部分课程设计包括了GAL和TTL的综合实验、高密度可编程器件CPLD实验、单片机、DSP实验等内容，突出EDA技术的设计思想。

本书可作为高等学校计算机、电子、通信、自动化等专业的配套辅助教材，亦可作为相关专业课教师及实验室技术人员的参考书。

## &lt;&lt;数字电路典型实验范例剖析&gt;&gt;

## 书籍目录

第一部分 基础知识 第1章 数字电路主要硬件简介 1.1 单片机简介 1.1.1 单片机的历史、现状及未来  
1.1.2 单片机的组成 1.1.3 单片机的开发 1.1.4 EM78P447单片机简介 1.2 DSP简介 1.2.1 DSP芯片的特点  
1.2.2 DSP在结构上的几大优势 1.2.3 DSP芯片的发展现状及其应用 1.2.4 DSP程序开发 1.3 嵌入式系统  
( Embedded System ) 1.3.1 嵌入式系统的定义 1.3.2 嵌入式系统的历史 1.3.3 嵌入式系统的特点 1.3.4  
嵌入式系统的分类 1.4 可编程器件简介 1.4.1 可编程逻辑器件的概念 1.4.2 可编程逻辑器件与专用集成  
电路 1.4.3 可编程逻辑器件的种类 1.4.4 可编程逻辑器件的发展动态 1.4.5 PLD技术和其他技术的比较  
1.5 通用阵列逻辑GAL的结构与特点 1.5.1 通用阵列逻辑GAL的特点 1.5.2 通用阵列逻辑的技术指标  
1.5.3 通用阵列逻辑的结构和工作原理 1.5.4 输出逻辑宏单元 ( OLMC ) 1.6 可编程阵列逻辑器  
件EPM7128简介 1.7 电路板制作工具Protel简介 1.7.1 DXP软件介绍 1.7.2 Protel软件的发展历史 1.7.3  
PCB板设计的工作流程 1.8 MAX + plus 软件介绍 1.8.1 MAX + plus 的功能特点 1.8.2 MAX + plus  
的系统要求 1.8.3 MAX + plus 的设计流程第二部分 单元实验 第2章 TTL单元电路实验 实验一 门电路  
的特性分析 实验二 特殊门电路的特性分析与设计 实验三 可控码制转换器的设计与实现 实验四 减法  
器和加法器的设计与实现 实验五 可控五进制计数器的设计与实现 实验六 1011序列检测器的设计与实  
现 实验七 流水灯的设计与实现第3章 通用阵列逻辑GAL实验 实验八 门电路设计与实现 实验九 组合  
逻辑电路的设计与实现 ( 一 ) 实验十 组合逻辑电路的设计与实现 ( 二 ) 实验十一 可控计数器的设计  
与实现第三部分 课程设计 第4章 TTL与GAL综合实验 第5章 高密度可编程器件CPLD实验 第6章 单片机  
实验 第7章 DSP实验

<<数字电路典型实验范例剖析>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>